Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0202U006034

Державний реєстраційний номер: 0199U000880

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-04-2002

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Фотоакустична спектроскопія кремнієвих наноструктур

Початок етапу: 01.1999

Закінчення етапу: 12.2001

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417302

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2651220

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Фотоакустична спектроскопія кремнієвих наноструктур

Назва роботи англійською:

Photoacoustic spectroscjpy of silicon nanostructures

Реферат українською:

Звітна робота є логічним продовженням досліджень, започаткованих в попередні роки. В ній отримано цілий ряд нових результатів, серед яких основне місце відведено створеним моделям, щодо кооперативного впливу факторів структурної неоднорідности і розмірного фактору в формуванні випромінювальних властивостей кремнієвих наноструктур та моделі трансформації одномодової в двохмодову функцію розмірного розподілу наночасток Si в SiO2.

Реферат англійською:

The reported work is a logical continuation of investigations undertaken during the recent years. Within its frame, a number of new results have been obtained. To the most important ones are attributed the suggested models describing the collective effect of structural inhomogeneties, along with the size factor, on radiative prperties of the silica nanostructures. Another important result is the suggested model of transition from the single-mode distribution of Si particles inside the SiO2 substanse, to the two-mode distribution5635

Індекс УДК: 534.2:533;534.2:532;534.2:539.2, 534.2:533; 534.2:532; 534.2:539.2

Коди тематичних рубрик: 29.37.15

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Блонський І.В.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Бродин М.С.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

